

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE**

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Dostawa licencji bezterminowej specjalistycznego oprogramowania LasX do analizy danych FLIM w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania oprogramowania.

LP.	<b>Minimalne parametry wymagane</b>	<b>Parametry oferowane (wypełnia Oferent)</b>  Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać.
A	B	C
Parametry techniczne		
	<p><b>Pakiet oprogramowania LAS X STELLARIS Offline Software-1szt</b>  <b>Oprogramowanie powinno mieć nast. funkcjonalności:</b>            LAS X Basic License (obróbka graficzna, podstawowe analizy morfometryczne i intensywności, eksport zdjęć)            - Live Data Mode - program do eksperymentów w czasie (np. przyżyciowych)            - Colocalization (analiza kolokalizacji struktur, automatyczne obliczanie istotności statystycznej współwystępowania wg kryterium Persona Lub Mandersa, overlay coefficient)            - FRET (analiza interakcji pomiędzy wyznaczonymi cząsteczkami &lt; 10 nm)            - FRAP (analiza dyfuzji cząsteczek, przepuszczalności błon - FLIP, ilości frakcji stałej i mobilnej, analiza danych z fotoaktywacji)            - Dye Finder (możliwość rozdzielenia spektralnego barwników wg różnych algorytmów)            - Electrophysiology (program do korelacji danych z obrazowania z danymi)</p>	

	<p><b>Pakiet oprogramowania LAS X FLIM Offline Analysis- 1szt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oprogramowanie powinno składać się z licencji oprogramowania do analizy FLIM oraz Phasor FLIM.</li> <li>- Oprogramowanie wymaga licencji oprogramowania sterującego LAS X STELLARIS lub oprogramowania LAS X Stellaris Offline.</li> </ul> <p><b>Oprogramowanie powinno między innymi. :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyznaczyć funkcję IRF (funkcja odpowiedzi instrumentu)</li> <li>- zawierać n-wykładniczą rekonwolucję i n wykładnicze dopasowanie krzywej zaniku z maksymalnie 5 komponentami</li> <li>- korekcję czasu martwego i różne algorytmy dopasowania zaniku.</li> <li>- zawierać analizator FLIM-FRET, zapewnia mapę wydajności FLIMFRET, pozorny obraz wydajności FRET i mapę wiązania.</li> </ul> <p>Analizę powinno się móc przeprowadzić zarówno na ROI, jak i na seriach obrazów (poklatkowych, z-stack, mozaika z Navigatora), które można analizować jako kompletny zestaw danych lub rozdzielać na obrazy. W pojedynczych pikselach oprogramowanie powinno dopasowywać i wyświetlać czasy życia oraz powinno rozdzielać komponenty zgodnie z czasem życia, co prowadzi do wyświetlania wielokanałowego. Wszystkie opcje dopasowania (ogólny zanik, ROI, dopasowanie pojedynczego piksela, separacja do kanałów) powinny być również dostępne z algorytmem dopasowywania wzorca, wybierając wzorzec poprzez wybranie ROI na obrazie lub na mapie różnorodności zaniku.</p> <p><b>Klucz sprzętowy dodatkowej licencji LAS X- 1szt</b></p>	
Inne		
	Gwarancja min. 12 miesięcy	
	Oprogramowanie powinno być kompatybilne z mikroskopem konfokalnym Stellaris 8, którego producentem jest Leica (Germany). Oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerze Zamawiającego, który nie jest przedmiotem wniosku.	

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)